

OPTICA ACTA

Volume 5 — 1958

ADMINISTRATION : *OPTICA ACTA*, 3 et 5, BOULEVARD PASTEUR,
PARIS 15^e

BOARD OF CONTROL — COMITÉ DIRECTEUR — KURATORIUM

J. M. OTERO Y NAVASCUES (Madrid), *Président*.

R. W. DITCHBURN (Reading, G. B.), *Secrétaire*.

A. ARNULF (Paris), A. BIOT (Gand), J. CABANNES (Paris), P. FLEURY (Paris),
F. GABLER (Vienne), G. HANSEN (Oberkochen), E. INGELSTAM (Stockholm),
H. KORTE (Braunschweig), W. S. STILES (London), G. TORALDO DI FRANCA
(Florence), A. C. S. VAN HEEL (Delft).

EDITORIAL BOARD — RÉDACTION — SCHRIFTLEITUNG

English editor : C. G. WYNNE, 13, Elwill Way, *Beckenham, Kent*.

Rédacteur français : A. MARÉCHAL, 3, boulevard Pasteur, *Paris*, 15^e.

Deutscher Herausgeber : G. FRANKE, Laufdorfer Weg 2, *Wetzlar*.

PUBLISHER — ÉDITEUR — VERLAG

Société de la *Revue d'Optique*, 3, boulevard Pasteur, *Paris*, 15^e.

Abonnement au tome 5 : **3 500 F** ou \$ 10

(environ 192 p.)

valeur sur Paris

à adresser à la *Revue d'Optique*, 3, boulevard Pasteur, *Paris* 15^e.

Conditions spéciales pour les membres des Comités nationaux d'optique

(s'adresser à ces Comités)

CONTENTS — TABLE DES MATIÈRES — INHALT

Pages

M. J. BERAN : Determination of the intensity distribution resulting from the random illumination of a plane finite surface	88
<i>Bibliographie</i>	64, 100, 109
D. CANALS-FRAU et M ^{me} M. ROUSSEAU : Influence de l'éclairage partiellement cohérent sur la formation des images de quelques objets étendus opaques	15
R. S. CRISP : voir P. FISHER.	
P. FISHER, R. S. CRISP and S. E. WILLIAMS : A photon-counting grazing incidence spectrometer for the 50-1 000 Å range	31
M. FRANÇON et M ^{lle} Y. GANDON : Etude des angles de raccordement des surfaces liquides avec les solides par les interférences en lumière polarisée	78
Y. GANDON (M ^{lle}) : voir M. FRANÇON.	
R. G. GIOVANELLI : The influence of scattering within photographic emulsions on resolving power.	27
<i>Informations</i>	63, 64
F. D. KAHN : On photon coincidences and HANBURY BROWN's interferometer	93
J. C. KELLY : The interferometry measurement of metal oxide films	75
E. H. LINFOOT : Quality evaluations of optical systems	1
A. MARÉCHAL : La diffusion résiduelle des surfaces polies et des réseaux	70
H. MARX : Linearisierung der Durchrechnungsformeln für windschiefe Strahlen (II)	65
M. ROUSSEAU (M ^{me}) : voir D. CANALS-FRAU.	
O. STIERSTADT und W. ZWIESLER : Einige Beobachtungen über die Wahrnehmbarkeit kurzdauernder, farbiger Lichterscheinungen und ihre Deutung	52
J. TSUJIUCHI : voir Y. UKITA.	
Y. UKITA and J. TSUJIUCHI : Interferometric study of microscope objectives	39
A. C. S. VAN HEEL and A. WALTHER : Some methods for measurements on thin films	47
A. WALTHER : voir A. C. S. VAN HEEL.	
E. WASSEF : Investigation into the theory of prediction of the appearance of colours and its bearing on the theory of colour vision	101
S. E. WILLIAMS : voir P. FISHER.	
W. ZWIESLER : voir O. STIERSTADT.	

ANALYTIC SUBJECT INDEX — TABLE ANALYTIQUE DES SUJETS — SACHVERZEICHNIS

	Pages		Pages
<i>Beugung</i> (s. u. Diffraction).		Information theory : Quality evaluations of optical systems	1
<i>Bibliographie</i> (voir Book Review).		Instruments : A photon counting spectrometer for 50-1 000 Å range	31
Book review 64, 100,	109	<i>Interferenz-Verfahren</i> (s. u. Interferometry).	
<i>Bücher</i> (s. o. Book Review).		<i>Optique géométrique</i> (voir Geometrical optics).	
Colloquium 63		<i>Prüfverfahren</i> (s. u. Testing).	
<i>Contrôle</i> (voir Testing).		<i>Sehen</i> (s. u. Vision).	
<i>Couches minces</i> (voir Thin layers).		Spectrometry : (see also Instruments).	
Diffraction : Influence de l'éclairage partiellement cohérent sur la formation des images. Intensity distribution resulting from the random illumination of a plate finite surface..	15 88	Testing (see also Thin layers).	
Diffusion : The influence of scattering within photographic emulsions 27		Interferometric study of microscope objectives	39
Diffusion résiduelle des surfaces polies et des réseaux 70		Etude des angles de raccordement des surfaces liquides avec les solides par interférences	78
<i>Dünne Schichten</i> (s. u. Thin layers).		Thin layers (see also Testing).	
Geometrical optics : Linearisierung der Durchrechnungsgleichungen für windschiefe Strahlen..	65	Some methods for measurements on thin films.....	47
Interferometry (see also Testing and Thin layers).		Interferometric measurements of metal oxide films	75
On photon coincidences and HANBURY BROWN's interferometer	93	Vision : Wahrnehmbarkeit kurz dauernder, farbiger Lichterscheinungen	52
		Prediction of the appearance of colours....	101